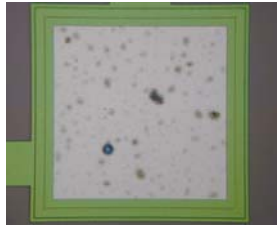


半導体電極パッド 表面変色調査

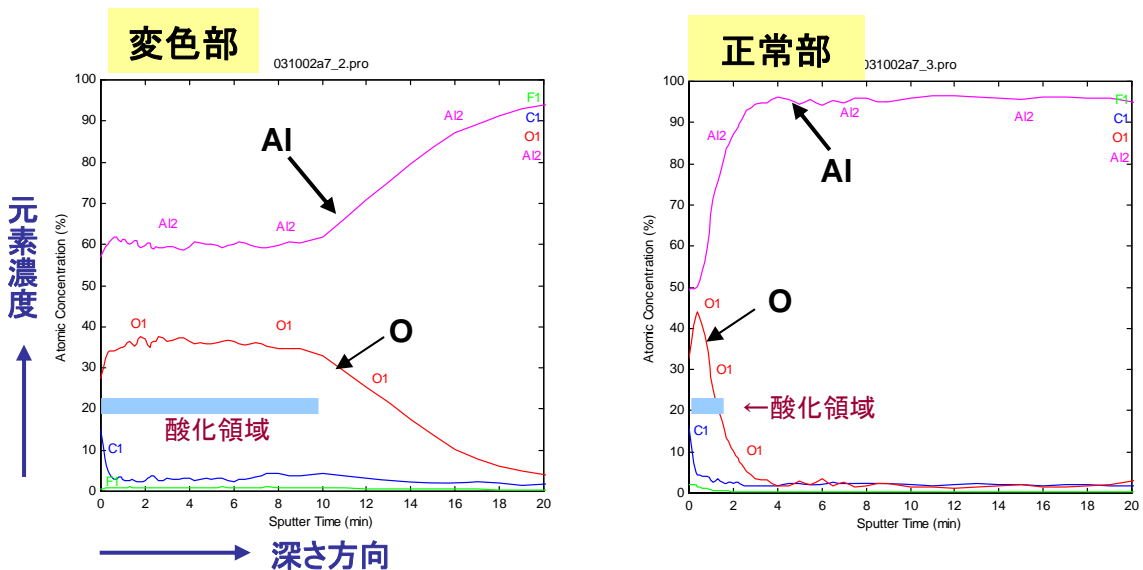


＜分析手法＞AES(オージェ電子分光分析)による
微小領域表面分析

半導体(IC)のアルミ電極パッドに、斑点状の変色が多数発生しました。変色部と正常部の元素を比較したところ、変色部では正常部に比べて酸素(O)が5倍以上深くまで存在し、アルミ(AI)が部分酸化していることが分かりました。



アルミ電極パッド表面 顕微鏡写真
斑点状の変色が多数発生



AESによる深さ方向分析結果

* アルゴンイオンでエッチングしながら分析